

2021

Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky –
Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti
kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení

ČSN
EN IEC 60749-20
ed. 3
35 8799

idt IEC 60749-20:2020

Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods –
Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering
heat

Dispositifs a semiconducteurs – Méthodes d,essais mécaniques et climatiques –
Partie 20: Résistance des CMS a boîtier plastique a l,effet combiné de l,humidité et de la chaleur de
brasage

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 20: Beständigkeit kunststoffverkappter oberflächenmontierbarer Bauelemente (SMD)
gegenüber der kombinierten Beanspruchung von Feuchte und Lötwärme

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60749-20:2020. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60749-20:2020. It
has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-10-05 se nahrazuje ČSN EN 60749-20 ed. 2 (35 8799) z května 2010, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje prostředky pro hodnocení odolnosti proti teplu při pájení uzavřených
polovodičů, jako jsou v plastu zapouzdřené součástky pro povrchovou montáž (SMD). Tato zkouška je
destruktivní.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60749-20:2020 dovoleno do
2023-10-05 používat dosud platnou ČSN EN 60749-20 ed. 2 (35 8799) z května 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

- začlenění technické opravy k IEC 60749-20:2008 (druhé vydání);
- zahrnutí nové kapitoly 3;
- zahrnutí vysvětlivek.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

IEC 60749-3 zavedena v ČSN EN 60749-3 ed. 2 (35 8799) Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola

IEC 60749-30 zavedena v ČSN EN IEC 60749-30 ed. 2 (35 8799) Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

IEC 60749-35 zavedena v ČSN EN 60749-35 (35 8799) Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.